(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2005年1月20日(20.01.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/005969 A1

(51) 国際特許分類7:

G01N 23/207, 23/223

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/009535

(22) 国際出願日:

2004年7月5日 (05.07.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-196155 2003年7月11日(11.07.2003)

- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 学校 法人早稲田大学 (WASEDA UNIVERSITY) [JP/JP]; 〒 1698050 東京都新宿区戸塚町一丁目 1 O 4番地 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 宇田応之 (UDA, Masayuki) [JP/JP]; 〒1698555 東京都新宿区大久保三 丁目 4 番 1 号 学校法人早稲田大学理工学部内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 榎本英俊 (ENOMOTO, Hidetoshi); 〒1930941 東京都八王子市狭間町 1 7 6 9-8 Tokyo (JP).

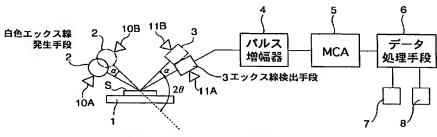
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可 能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、 定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

- (54) Title: ENERGY DISPERSION TYPE X-RAY DIFFRACTION/SPECTRAL DEVICE
- (54) 発明の名称: エネルギー分散型エックス線回折・分光装置



- 2...WHITE X-RAY GENERATING MEANS
- 3...X-RAY DETECTING MEANS
- 4...PULSE AMPLIFIER
- 6...DATA PROCESSING MEANS

(57) Abstract: A white X-ray generating means (2) and an X-ray detecting means (3) are respectively moved to a most product (shown by a solid line in the Fig.) and a second position (shown by a one-dot-chain line in the Fig.) that are separated, X-ray intensities, for each energy, detected at respective positions by the X-ray detecting means are obtained as first data and second data, and that is refraction-X-ray-only data, is obtained based on the difference between the first data and the second data, and the first or second data and the third data.

白色エックス線発生手段2とエックス線検出手段3とをそれぞれ離散した第1の位置(図中、実線での ○ 位置)と第2の位置(図中、一点鎖線での位置)とに移動させて、それぞれの位置におけるエックス線検出手段に より検出された各エネルギー毎のエックス線強度を、第1のデータ、第2のデータとして得、また第1のデータと 第2の位置との差分に基づいて第3のデータつまり回折エックス線だけのデータを得、さらに第1、または第2の データを第3のデータとの差分から蛍光エックス線に関するデータを得る。



005/